

Fiche produit		Statistique de base appliquée à la métrologie		Page : 1 sur 1	
Document N° : 88-0070/05		Distribution : Interne : DOQS Externe : Oui	Validé par : FPa	Date version 1 : 2012-02-05	Impression le : 2017-07-10
Société :		Certificat :	Passport DOQS :	<small>Worldwide Copyright.com</small>	
Nb jours :	2	Prix :	Formateur :	Consultants expérimentés	Nombre de personnes :
Neuchâtel – 00 41 7878 10 704 – Info@DOQS.ch					

Vous recherchez

Les notions élémentaires de statistique utilisées en métrologie seront assimilées par les participants au travers d'apports théoriques, d'exercices et de manipulations d'instruments de mesure. Cette approche permettra aux participants de mieux comprendre la signification des principales caractéristiques d'un instrument de mesure et surtout d'appréhender des notions métrologiques plus complexes.

Le contenu est le suivant

Premier jour

- Vocabulaire statistique
- Notion d'échantillon et de population
- Échantillons au hasard
- Expériences aléatoires
- Répétabilité et reproductibilité
- Statistique descriptive
- Moyenne, médiane, écart type
- Distribution des mesures
- Histogramme

Deuxième jour

- Loi de distribution
- Loi normale, rectangulaire
- Intervalle de confiance
- Intervalle statistique de dispersion
- Justesse, fidélité et exactitude d'un instrument de mesure

Vous êtes

- Tout collaborateur utilisant des instruments de mesures dans le cadre de son travail ou devant interpréter des résultats de mesure.

Prérequis

- Aucun prérequis au niveau du vocabulaire et des concepts de base n'est nécessaire



Nous proposons la méthodologie suivante

Explications théoriques et exemples pratiques

Manipulations d'instruments de mesure

De nombreux exercices facilitant l'échanges entre les participants

Cartes de mémorisations.